

FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 600: X-ışını Floresans Analizi ancak bu kadar basit olabilir

Hızlı, Uygun Maliyetli XRF Ölçümleri için Optimize Edildi

FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 600 ile, Fischer X-RAY ailesine universal olarak uygulanabilir yeni bir ölçüm cihazı sunuyoruz. XDAL 600, kaplama kalınlığı ölçümü ve malzeme analizi için kullanıcı dostu bir X-ışını floresan (XRF) masa üstü cihazı olarak tasarlanmıştır. Kompakt, kullanışlı bir tasarıma sahiptir. Bununla birlikte, hassas ölçüm bileşenleri olan detektör ve X-ışını kaynağına sahiptir. İnce katmanları ($\leq 0,1 \mu\text{m}$) hassas, hızlı ve tahribatsız bir şekilde ölçer. Ek olarak, karmaşık alaşımli veya düşük konsantrasyonlu kaplamaların XRF analizini kolayca gerçekleştirir.

İçsel Değerler Önemlidir

XDAL 600, her ölçüm için ideal ölçüm koşullarını oluşturmak için elektriksel olarak değiştirilebilir 4 adet kolimatörün yanı sıra 3 adet değiştirilebilir primer filtreye sahiptir ve bu da çok çeşitli ölçüm görevleri için maksimum esneklik sağlar. Manuel olarak ayarlanabilen numune tablası (makas masası) ile numuneler hızlı

ve rahat bir şekilde konumlandırılabilir. Patentli DCM (Mesafe Kontrollü Ölçüm) yöntemi sayesinde, karmaşık geometrilerin ölçümü bile kolaydır.

Cihazımız Yeni Nesil Dijital Pulse Prosesör (DPP+) ile Donatıldı

XDAL 600, firma içinde geliştirilmiş dijital pulse prosesörle yani DPP + ile donatılmıştır. Böylece, yüksek sayım oranlarını işlemek, maksimum ölçüm hassasiyetine ve daha kısa ölçüm sürelerine sahip olmak mümkündür.

Sağlamlık, Doğruluk ve Uzun Süreli Kararlılık

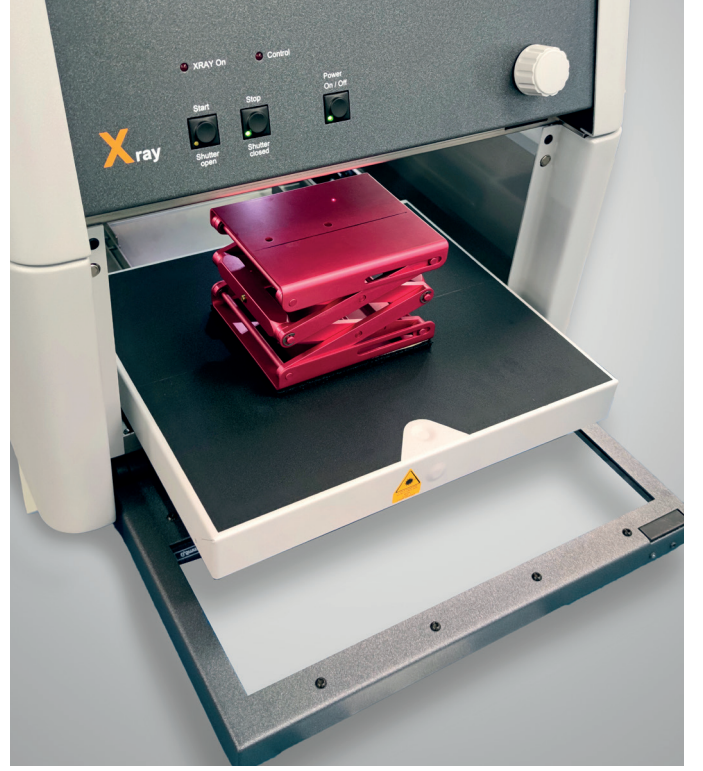
XDAL 600'ün geliştirilmesi sırasında sağlamlığa özel önem verildi. Bu nedenle, tüm gereksinimler, elektrolitik kaplama ve üretim ortamları gibi tüm koşullar altında uzun bir hizmet ömrü için uygundur. Tüm Fischer X-RAY cihaz portföyü gibi, bu cihaz da olağanüstü doğruluk ve uzun süreli kararlılığa sahiptir. Bu, kalibrasyon işini önemli ölçüde azaltır ayrıca zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Uygulamalar

- Kurşun çerçeveler, konektörler veya elektronik baskılı devre kartları üzerindeki fonksiyonel kaplamalar ve yarı iletken endüstrileri
- Karmaşık çoklu kaplama sistemlerinin ölçülmesi
- Lehimdeki kurşun içeriğinin belirlenmesi
- NiP kaplamalarda fosfor içeriğinin belirlenmesi

Özellikleri

- XRF ölçüm cihazı, DIN ISO 3497 ve ASTM B 568 X-ışını standartlarını karşılar
- 0,1 µm (0,004 mils) olan çok ince kaplamaların tahribatsız malzeme analizi ve kaplama kalınlığı ölçümü
- 4x değiştirilebilir diyafram (kolimatör): Ø 0,1 mm (3,9 mils), Ø 0,3 mm (11,8 mils), Ø 1 mm (39,4 mils), Ø 3 mm (118 mils)
- 3 adet değiştirilebilir primer filtre
- Hızlı ve kolay numune konumlandırma için manuel olarak ayarlanabilen numune tablası (makas tablası ile kullanım)
- Kompakt tasarımı sayesinde XRF cihazı hafiftir ve çok az yer kaplar
- Konumlandırma yardımcısı olarak lazer işaretçi, numunenin hızlı yerleştirilmesini destekler
- Yüksek çözünürlüklü renkli video kamera sayesinde, ölçüm yeri kolayca belirlenir
- Kullanıcı dostu Fischer WinFTM® yazılımı ile ölçüm yapmak, ölçümlerin değerlendirilmesi ve ölçülen değerlerin raporlaştırılması son derece kolaydır



Manuel olarak ayarlanabilen numune tablası



Bizimle iletişime geçin

www.helmut-fischer.com